



中华人民共和国国家标准

GB/T 9325—1996
idt IEC 384-10-1:1989
QC 301 901

电子设备用固定电容器 第10部分:空白详细规范 多层片式瓷介电容器 评定水平 E

Fixed capacitors for use in electronic equipment
Part 10:Blank detail specification
Fixed multilayer ceramic chip capacitors
Assessment level E

1996-07-09发布

1996-12-01实施

国家技术监督局发布

目 次

前言	I
IEC 前言	IV
引言	1

第 1 章 一 般 数 据

1 一般数据	3
1.1 推荐的安装方法	3
1.2 尺寸	3
1.3 额定值和特性	3
1.4 有关文件	3
1.5 标志	3
1.6 订货资料	4
1.7 放行批证明记录	4
1.8 附加内容	4
1.9 对总规范和/或分规范的规定而言,增加或提高的严酷度或要求	4

第 2 章 检 验 要 求

2 检验要求	4
2.1 程序	4

前　　言

本标准等同采用国际标准 IEC 384-10-1:1989《电子设备用固定电容器 第 10 部分: 空白详细规范: 多层片式瓷介电容器》及其第 1 号修订单(1993)。该标准所包括的多层片式瓷介电容器, 我国已生产了数年, 引进了数条生产线, 在技术指标、试验严酷度和质量保证等方面已达到国际标准水平。制定本标准为促进该类产品的国际贸易与技术交流, 参加国际质量认证, 打下了良好的基础。

本标准代替 GB 9325—88, 因为 GB 9325—88 是等同采用 IEC 384-10-1 的中办文件, 国际电工委员会于 1989 年发布了正式版本即 IEC 384-10-1(QC 301 901), 两者在条款的编排和技术内容上有一定的差别, 本次对 GB 9325—88 进行修订, 使其与 IEC 384-10-1 的正式版本协调一致。

本标准是 GB/T 9324—1996(idt IEC 384-10:1989, Amendment 1(1993))《电子设备用固定电容器 第 10 部分: 分规范多层片式瓷介电容器》的补充, 是制定该类产品详细规范的依据。标准中规定的试验方法和严酷度等级是从 GB 2693—90《电子设备用固定电容器 第 1 部分: 总规范》(idt IEC 384-1: 1982, Amendment 2(1987), Amendment 3(1989))中选取的。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准由电子工业部标准化研究所起草。

本标准主要起草人: 霍光。

本标准 1988 年 6 月首次发布。

IEC 前言

- 1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。
- 2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。
- 3) 为了促进国际上的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准。IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

序 言

本标准是由国际电工委员会第 40 技术委员会(电子设备用电容器和电阻器)制定的。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
40(C. O.)630	40(C. O.)666
40(C. O.)598	40(C. O.)646
40(C. O.)599	40(C. O.)647

从上表列出的表决报告中可以查阅到更详细的资料。

本标准封面的 QC 号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准中引用的其他 IEC 标准:

- IEC 384-1(1982) 电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范
第 2 号修订单(1987)和第 3 号修订单(1989)
IEC 384-10(1989) 第 10 部分:分规范:多层片式瓷介固定电容器
IEC 410(1973) 计数检查抽样方案和程序

中华人民共和国国家标准

电子设备用固定电容器 第10部分：空白详细规范 多层片式瓷介电容器 评定水平E

GB/T 9325—1996
idt IEC 384-10-1:1989
QC 301 901
代替 GB 9325—88

Fixed capacitors for use in electronic equipment
Part 10:Blank detail specification
Fixed multilayer ceramic chip capacitors
Assessment level E

引言

空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充性文件，并包括详细规范的格式、编排和最少内容的要求。不遵守这些要求的详细规范，不认为是符合电子元件质量评定体系要求的标准。

制定详细规范时，应考虑分规范 1.4 的内容。

首页括号内数字标注的位置上应填写下列相应内容：

详细规范的识别：

- (1) 授权起草本详细规范的组织：IEC 或国家标准机构。
- (2) IEC 或国家标准的详细规范编号、发布日期以及国家体制需要的其他内容。
- (3) IEC 或国家标准的总规范编号及其版本号。
- (4) IEC 或国家标准的空白详细规范编号。

电容器的识别：

- (5) 该型号电容器的简述。
- (6) 典型结构的简述(当适用时)。

(7) 对影响互换性的主要尺寸的外形图和/或引用国家的或国际的外形方面的文件。另一种方法，也可以在详细规范附录中给出这种图形。

(8) 应用或涉及的应用组别和/或评定水平。

注：详细规范中采用的一个或几个评定水平，应从分规范 3.5.4 中选取。这意味着只要试验组的划分不变，几个评定水平可以共用一个空白详细规范。

(9) 重要特性的参考数据，以便在各种类型电容器之间进行比较。